PENGARUH WAKTU PUTAR SPIN COATING TERHADAP SIFAT LISTRIK DAN OPTIK LAPISAN TIPIS NANOKOMPOSIT PVA/ZNO

Abdillah Faiz Indratama¹, Aurisa Prastika², Fathi Ibrahim³, Miftahul Khoiri⁴, Satria Muhammad Saglan⁵, Wan Rizti Fadila⁶, Abrar Ismardi^{7*}, Muhammad Nasir⁸. Hakimin Abdullah⁹

 ^{1,2,3,4,5,6,7}Prodi S1 Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom
⁸Loka Penelitian Teknologi Bersih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
⁹Advanced Materials Research Cluster, Faculty of Bioengineering and Technology, University Malaysia Kelantan.

*Alamat Korespondensi: abrarselah@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Penelitian mengenai pengaruh waktu putar dari metode spin coating terhadap sifat listrik dan optik lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan kecepatan 1000 rpm selama 30, 60, dan 90 detik dan dikeringkan pada suhu 55°C. Karakterisasi SEM menunjukkan banyak terjadi aglomerasi dan SEM cross section menunjukkan ketebalan 2076 nm, 2771 nm, dan 2216 nm. Karakterisasi XRD menunjukkan lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO bersifat semi kristalin yang menunjukkan struktur heksagonal pada ZnO. Nanokomposit PVA/ZnO memiliki nilai energi gap sebesar 3.32 eV dengan nilai maksimum abrobansi 0,228 pada waktu putar 60 detik dan nilai minimum absorbansi 0,076 pada waktu putar 90 detik setelah melakukan pengKarakterisasian UV-Vis. Karakterisasi sifat listrik menggunakan keithley 2400 dengan pengamatan kurva I-V menunjukkan bahwa sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO bersifat isolator.

© 2021 Departemen Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

Kata kunci: Nanokomposit PVA/ZnO, SEM, spin coating, UV-Visible, XRD.

PENDAHULUAN

Polimer nanokomposit akhir-akhit ini menarik banyak perhatian peneliti dalam mengembangkan nanoteknologi, hal ini didasari oleh keunggulan polimer dalam fleksibilitas, sturktur proses fabrikasi. pengaturan sifat seperti fotokonduktivitas, luminesensi efisien. dan potensi semikonduktor (Alhoshan et al., 2010). Penggunaan dari polimer nanokomposit digunakan dalam bidang banyak optoelektronik dan teknologi fotonik [2] (Aslam et al., 2018) dikarenakan material polimer nanokomposit mudah di dopping dengan bahan lain. Salah satu contoh polimer nanokomposit yang sering didoping adalah ZnO, TiO2, Ag, Au, dan lain lain, untuk mendapati sifat optik dan listrik yang diingikan (Aziz et al., 2017; Kandulna & Choundhary, 2017; Porel et al., 2007).

ZnO adalah salah satu jenis material yang diunakan dalam polimer nanokomposit dalam pembuatan perangkat

optik. ZnO dapat dikategorikan sebagai semikonduktor logam oksida dan memiliki bandgap 3,37eV pada suhu ruangan. ZnO juga memiliki energi pengikat eksiton 60 sehingga cocok untuk meV diiadikan perangkat optoelektronik pada wilayah UV dan perangkat tampilan optik dikarenakan sifat optik yang dimiliki cukup bagus (Kumar et al., 2015). Salah satu aplikasinya dalam bidang optik adalah dioda pemancar cahaya biru, dioda pemancar cahaya UV, konduktor elektroda dalam sel surva, sensor gas, sensor kimia, dan biosensor yang direkayasa sehingga memiliki struktur nanokomposit vang bagus seperti nanowires. nanorods, nanobelts. nanoneedles dan nanosheets (Viswanath, 2016).

Material sensor optik yang ZnO perlu adanya menggunakan penguatan mekanik. Agar dalam sifat terperolehnya penguatan mekanik maka diperlukannya matriks yang berperan sebagai rangka pada nanokomposit tersebut. Matriks pada nanokomposit terdapat tiga jenis sesuai material yang digunakan yaitu metal, keramik, dan polimer.

Polimer yang cocok digunakan sebagai matriks untuk ZnO adalah Polyvinyl alcohol (PVA) karena memiliki kelebihan sebagai polimer yang biodegradasi, tidak beracun, dan biokompatibel (Lee et al., 2008; Sreeja et al., 2013). Selain hal tersebut PVA juga memiliki band gap 5,38 eV sehingga membuatnya bersifat polimer konduktif, hal meniadikan PVA memiliki ini peluana menjadi material optoelektronik (Aslam et al., 2018) .Penggunaan filler ZnO pada matriks PVA juga dapat meningkatkan kekuatan tarik, perpanjangan ketika putus dan konstanta konduktivitas AC dielektrik sehingga dapat menciptakan material yang fleksibel terhadap tekanan sebagai dijadikan penyusun suatu peragkat seperti sensor (Chamankar et al., 2020).

Jenis-jenis fabrikasi nanokomposit PVA/ZnO yang menghasilkan lapisan tipis antara lain adalah Electron beam evaporation, teknik sputtering, dip coating, spin coating, dll. Metode spin coating merupakan teknik yang sering digunakan pembuatan lapisan dalam tipis nanokomposit dikarenakan kemudahannya dalam mengatur ketebalan dari lapisan tipis mengatur beberapa hanva dengan parameter seperti kecepatan dan waktu coating (Jilani et al., 2017).

Pada penelitian Fitriani (2017) dalam fabrikasi lapisan tipis pasta ZnO dengan merubah parameter suhu dan waktu spin coating dan konsentrasi pembuatan pasta ZnO menggunakan PVA dan ZnO dengan perbandingan 1:1. Suhu yang digunakan 500°C, 600°C adalah 400°C, dan sedangkan waktu yang digunakan 4 menit dan 6 menit, dimana menghasilkan nilai absorbansi maksimal pada suhu 400°C dengan di panjang waktu 6 menit gelombang 208,22 nm sebesar 0,944 dan nilai absorbansi minimum pada suhu 500°C dengan waktu 4 menit di panjang gelombang 254.05 nm vaitu 0.198 (Fitriani & Handani, 2017).

Diharapkan pada penelitian ini dengan merubah parameter waktu dengan kecepatan yang tetap spin coating dapat menghasilkan lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO dengan ketebalan yang menghasilkan keuntungan sifat listrik dan sifat optik yang pada akhirnya memenuhi syarat menjadi material sensor optik yang fleksibel.

METODE

1. Sintesis Nanokomposit PVA-ZnO

PVA dilarutkan ke dalam 5 mL aquades dengan konsentrasi 10% w/v kemudian diaduk di atas magnetic stirrer dengan suhu 45°C selama 2 jam. Kemudian ZnO nanopowder dengan konsentrasi 1% w/v ditambahkan ke dalam larutan PVA dan dilakukan pengadukan selama 2 jam pada suhu ruang untuk menghasilkan larutan nanokomposit PVA/ZnO. Dilanjutkan proses sonikasi selama 30 menit untuk memastikan ZnO tersebar merata. Larutan nanokomposit PVA/ZnO di deposisi diatas substrat kaca menggunakan metode spin coating dengan variasi waktu putar 30, 60, dan 90 detik.

2. Karakterisasi Nanokomposit PVA/ZnO

Karakterisasi dilakukan untuk mengetahui sifat nanokomposit PVA/ZnO. Karakterisasi yang dilakukan berupa SEM-EDX, XRD, dan UV- vis.

3. Pengukuran Sifat Listrik

Karakterisasi sifat listrik menggunakan alat Keithley 2400 dengan terlebih dahulu melakukan preparasi sampel. Sampel diletakkan pada pcb yang sudah diberi elektroda berupa pasta perak dan dihubungkan dengan keithley yang sudah terhubung dengan laptop. Pengukuran sifat listrik menggunakan keithlev dengan memberi tegangan pada sampel untuk mendapatkan nilai arus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Sintesis Lapisan Tipis Nanokomposit PVA/ZnO

Pada proses *spin coating* untuk mendapati variasi 3 sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO dilakukannya beberapa step yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Spin Coating					
FT 1					
Step	Ramp	Pick Dwell (s)			
	(s)		RPM		
0	20	10	600		
1	20	10	700		
2	20	30	1000		
3	20	10	650		
		FT 2			
Step	Ramp	Pick Dwell (s)			
	(s)		RPM		
0	20	10	600		
1	20	10	700		
2	20	60	1000		
3	20	10	650		
	FT 3				
Step	Ramp	Pick			
	(s)	Dwell (s)	RPM		
0	20	10	600		
1	20	10	700		
2	20	90	1000		
3	20	10	650		

Hasil variasi sampel dengan spin coating menghasilkan sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO dengan warna putih transparan yang ditunjukkan pada Gambar 1, warna putih transparan tersebut berasal dari pelarutan bubuk ZnO nano. Setelah spin coating sampel dikeringkanuntuk memaksimalkan penguapan larutan.



Gambar 1. (a) Sampel FT 1, (b) Sampel FT 2, (c) Sampel FT 3

3.2. Hasil Scanning Electron Microscope (SEM)

Uji morfologi dengan *Scanning Electron Miscroscope* (SEM) ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar menunjukkan nanopartikel dari sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO dimana terdapat aglumerasi pada sampel. Tiga sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO kemudian dilakukan karakterisasi morfologi menggunakan *Scanning Electron Miscroscope* (SEM). Hasil SEM tertera pada Gambar 2 menunjukkan gambar nanopartikel dari lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO. Dari gambar SEM menunjukkan aglomerasi pada semua sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO, untuk partikel yang dapat dilihat pada sampel FT 1 terdapat nanopartikel berukuran 81 nm, FT 2 149 nm, dan FT 3 166 nm.



Gambar 2. Hasil Pengukuran SEM 30000x Perbesaran (a) sampel FT 1; (b) sampel FT 2; (c) sampel FT 3.



Gambar 3. Hasil Pengukuran *cross section* (a) sampel FT 1; (b) sampel FT 2; (c)sampel FT 3.

Hasil dari SEM cross section pada Gambar 3 dan pengukurannva menghasilkan ketebalan sampel FT 1 ketebalan 2076 2 memiliki nm, FT ketebalan 2771 nm, dan FT 3 ketebalan 2216 nm. Dari hasil cross section dapat diketahui bahwa pengaruh parameter waktu spin coating yaitu semakin lama waktu maka semakin tebal lapisan tipis yang didapati, ada pula waktu optimal

dalam mendapati ketebalan yang lebih tebal yaitu pada waktu 60 detik.

3.3. Hasil Pengukuran EDX

Hasil pengukuran EDX diperlihatkan pada Tabel 2, dimana hasil menunjukkan komposisi atom pada lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO adalah C, O, Si, Ca, dan Zn.

$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Tabel 2. Hasil Pengukuran EDX Sampel FT 1, FT 2, dan FT 3							
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				FT1				
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Element	Line	Apparent	k Ratio	Wt%	Wt%	Atomic	Standard
C K 38.47 0.38472 61.30 0.44 71.03 C Vit O K 26.86 0.09037 27.59 0.42 23.99 SiO2 Si K 25.39 0.20122 8.61 0.11 4.27 SiO2 Ca K 25.39 0.20122 8.61 0.11 4.27 SiO2 Ca K 2.77 0.02769 1.16 0.12 0.25 Zn Ca K 2.77 0.02769 1.16 0.12 0.25 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 Standard Label C K Standard Label C Vit Standard Label C Vit Standard Label Standard Label C Vit Standard Label		Туре	Concentration			Sigma	%	Label
Series SiO2 Series SiO2 Si K 25.39 0.20122 8.61 0.11 4.27 SiO2 Ca K 4.00 0.03570 1.34 0.05 0.47 Wollastonite Zn K 2.77 0.02769 1.16 0.12 0.25 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 1.34 0.77 7.63 C Element Line Apparent k Ratio Wt% Wt% Atomic Standard Concentration Sigma % Label C Vit SiO2 C O K 15.26 0.1526 61.11 0.7 70.63 C Vit O K series 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K series 0.66 0.00661 <td>С</td> <td>K</td> <td>38.47</td> <td>0.38472</td> <td>61.30</td> <td>0.44</td> <td>71.03</td> <td>C Vit</td>	С	K	38.47	0.38472	61.30	0.44	71.03	C Vit
O K 26.86 0.09037 27.59 0.42 23.99 SiO2 Si K 25.39 0.20122 8.61 0.11 4.27 SiO2 Ca K 4.00 0.03570 1.34 0.05 0.47 Wollastonite Zn K 2.77 0.02769 1.16 0.12 0.25 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.02 20.25 Zn Element Line Apparent Concentration k Ratio Wt% Wt% Label Label C Vit 100.00 100.00 C K series 15.26 0.1526 61.11 0.7 70.63 C Vit O K series 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K series 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K series 1.63 0.01454 1		series						
Series Si 0.20122 8.61 0.11 4.27 SiO2 Ca K series 4.00 0.03570 1.34 0.05 0.47 Wollastonite Zn K 2.77 0.02769 1.16 0.12 0.25 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 Element Line Apparent Type Apparent Concentration K Ratio Wt% Wt% Sigma Matomic Standard Sigma C K series 15.26 0.1526 61.11 0.7 70.63 C Vit O K series 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K series 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K series 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K series 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: Total: Apparent Concentration K Ratio Wt% Wt% Sigma Xtomic Standard Sigma Xtomic Standard Sigma	0	K	26.86	0.09037	27.59	0.42	23.99	SiO2
Si K 25.39 0.20122 8.61 0.11 4.27 SiO2 Ca K 4.00 0.03570 1.34 0.05 0.47 Wollastonite Zn K 2.77 0.02769 1.16 0.12 0.25 Zn Total: 100.00 100.00 FT2 Element Line Apparent k Ratio Wt% Wt% Label C Vit C K series 15.26 0.1526 61.11 0.7 70.63 C Vit O K series 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K series 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K series 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: Total Line Apparent K Ratio Wt% Wt% Sigma Kemio		series						
Series Series<	Si	K	25.39	0.20122	8.61	0.11	4.27	SiO2
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		series						
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Ca	K	4.00	0.03570	1.34	0.05	0.47	Wollastonite
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		series						
	Zn	K	2.77	0.02769	1.16	0.12	0.25	Zn
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		series						
FT2 FT2 Element Line Apparent k Ratio Wt% Wt% Atomic Standard C K 15.26 0.1526 61.11 0.7 70.63 C Vit O K 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 Image: Concentration K Ratio Wt% Wt% Atomic Standard Type Concentration K Ratio Wt% Wt% Mtomic Standard Zh Series 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4	Total:				100.00		100.00	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				FT2				
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c } \hline Type & Concentration & Sigma & \% & Label \\ \hline C & K & 15.26 & 0.1526 & 61.11 & 0.7 & 70.63 & C & Vit \\ \hline Series & 10.83 & 0.03644 & 28.25 & 0.67 & 24.51 & SiO2 \\ \hline Series & 9.94 & 0.07873 & 8.55 & 0.17 & 4.23 & SiO2 \\ \hline Series & 9.94 & 0.07873 & 8.55 & 0.17 & 4.23 & SiO2 \\ \hline Ca & K & 1.63 & 0.01454 & 1.39 & 0.08 & 0.48 & Wollastonite \\ \hline Series & 1.63 & 0.01454 & 1.39 & 0.08 & 0.48 & Wollastonite \\ \hline Zn & K & 0.66 & 0.00661 & 0.71 & 0.18 & 0.15 & Zn \\ \hline Total: & & 100.00 & 100.00 & \\ \hline Total: & & 100.00 & 100.00 & \\ \hline \hline Total: & & FT3 & \\ \hline Element & Line & Apparent & k Ratio & Wt% & Wt% & Atomic & Standard \\ \hline Type & Concentration & & Sigma & \% & Label & \\ \hline C & K & 42.38 & 0.42378 & 62 & 0.43 & 71.21 & C & Vit \\ O & K & 28.09 & 0.09453 & 28.4 & 0.42 & 24.49 & SiO2 \\ \hline Si & K & 22.65 & 0.17949 & 7.57 & 0.1 & 3.72 & SiO2 \\ \hline Ca & K & 3.73 & 0.03328 & 1.23 & 0.05 & 0.42 & Wollastonite & \\ \hline \hline T & Voltastonite & V & V & V & V & V & V & V & V & V & $	Element	Line	Apparent	k Ratio	Wt%	Wt%	Atomic	Standard
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c } C & K & 15.26 & 0.1526 & 61.11 & 0.7 & 70.63 & C & Vit \\ \hline Series & 10.83 & 0.03644 & 28.25 & 0.67 & 24.51 & SiO2 \\ \hline Si & K & 9.94 & 0.07873 & 8.55 & 0.17 & 4.23 & SiO2 \\ \hline Ca & K & 1.63 & 0.01454 & 1.39 & 0.08 & 0.48 & Wollastonite \\ \hline Series & 1.63 & 0.01454 & 1.39 & 0.08 & 0.48 & Vollastonite \\ \hline Ca & K & 0.66 & 0.00661 & 0.71 & 0.18 & 0.15 & Zn \\ \hline Total: & & 100.00 & 100.00 & \\ \hline Total: & & FT3 & \\ \hline Element & Line & Apparent & K Ratio & Wt% & Wt% & Atomic & Standard \\ \hline Type & Concentration & & FT3 & \\ \hline C & K & 42.38 & 0.42378 & 62 & 0.43 & 71.21 & C & Vit \\ O & K & 28.09 & 0.09453 & 28.4 & 0.42 & 24.49 & SiO2 \\ \hline Si & K & 22.65 & 0.17949 & 7.57 & 0.1 & 3.72 & SiO2 \\ \hline Ca & K & 3.73 & 0.03328 & 1.23 & 0.05 & 0.42 & Wollastonite \\ \hline T & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite \\ \hline T & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite \\ \hline T & Series & 27.5 & 0.17949 & 7.57 & 0.1 & 3.72 & SiO2 \\ \hline Ca & K & 3.73 & 0.03328 & 1.23 & 0.05 & 0.42 & Wollastonite \\ \hline T & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite \\ \hline T & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite & Vollastonite \\ \hline T & Vollastonite & Vollast$		Туре	Concentration			Sigma	%	Label
Series 10.20 0.1320 0.111 0.7 70.03 O K 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: Total 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: Total 0.166 0.00661 0.71 0.18 0.48 Vollastonite Element Line Apparent K Ratio Wt% Wt% Standard Label C K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65	С	K	15.26	0 1526	61 11	0.7	70.63	C Vit
O K 10.83 0.03644 28.25 0.67 24.51 SiO2 Si K 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: 0.066 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Element Line Apparent concentration K Ratio Wt% Wt% Atomic Sigma Standard Label C K series 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K series 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K series 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Si K series 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite <td></td> <td>series</td> <td>15.20</td> <td>0.1520</td> <td>01.11</td> <td>0.7</td> <td>70.03</td> <td></td>		series	15.20	0.1520	01.11	0.7	70.03	
series 10.03 0.03844 28.23 0.07 24.31 Si K 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 C K Apparent Series k Ratio Wt% Wt% Sigma Atomic Mic Label Standard Label C K 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Si K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	0	K	10.92	0.03644	28.25	0.67	24 51	SiO2
Si K 9.94 0.07873 8.55 0.17 4.23 SiO2 Ca K 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 C K Apparent Concentration k Ratio Wt% Wt% Atomic Label Standard Label C K 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Sa K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite		series	10.05	0.03044	20.25	0.07	24.51	
series 9.94 0.07873 8.33 0.17 4.23 Ca K 1.63 0.01454 1.39 0.08 0.48 Wollastonite Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: 100.00 100.00 FT3 Element Line Apparent k Ratio Wt% Wt% Atomic Standard C K 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	Si	K	0.04	0 07973	8 55	0.17	1 22	SiO2
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		series	9.94	0.07875	0.00	0.17	4.23	
series 1.63 0.01434 1.39 0.06 0.48 Zn K 0.66 0.00661 0.71 0.18 0.15 Zn Total: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Element Line Apparent k Ratio Wt% Wt% Atomic Standard C K 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	Ca	K	1.62	0.01454	1 20	0.09	0.49	Wollastonite
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		series	1.05	0.01434	1.59	0.08	0.40	
series 0.00 0.000 f 0.11 0.10 0.13 Total: 100.00 100.00 100.00 FT3 Element Line Type Apparent Concentration k Ratio K Wt% Sigma Mt% K Atomic Label Standard Label C K series 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K series 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K series 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K series 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	Zn	K	0.66	0.00661	0 71	0.18	0 15	Zn
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		series	0.00	0.00001	0.71	0.10	0.10	
FT3ElementLine TypeApparent Concentrationk RatioWt% Wt%Wt% Wt%Atomic LabelStandard LabelCK series42.38 28.990.42378620.43 0.4271.21C VitOK series28.09 28.490.0945328.4 0.420.42 24.4924.49 SiO2SiO2SiK series22.65 0.179490.17949 7.577.57 0.10.1 3.72SiO2CaK series3.73 3.730.033281.23 1.230.050.42 0.42Wollastonite	Total:				100.00		100.00	
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				FT3				
Type Concentration Sigma % Label C K 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	Element	Line	Apparent	k Ratio	Wt%	Wt%	Atomic	Standard
C K series 42.38 0.42378 62 0.43 71.21 C Vit O K series 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K series 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K series 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite		Туре	Concentration			Sigma	%	Label
series 42.30 0.42373 62 0.43 71.21 C Vit O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	С	K	12 38	0 42378	62	0.43	71 21	C Vit
O K 28.09 0.09453 28.4 0.42 24.49 SiO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite		series	42.00	0.42370	02	0.45	71.21	O VII
series 28.09 0.09433 28.4 0.42 24.49 SIO2 Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	0	K	28.00	0 00/53	28 /	0.42	24.40	SiO2
Si K 22.65 0.17949 7.57 0.1 3.72 SiO2 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite		series	20.09	0.03433	20.4	0.42	24.49	5102
series 22.05 0.17949 7.57 0.1 3.72 3102 Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite	Si	К	22.65	0 17040	7 57	0.1	2 72	SiO2
Ca K 3.73 0.03328 1.23 0.05 0.42 Wollastonite		series	22.05	0.17949	7.57	0.1	5.72	3102
series 5.75 0.05526 1.25 0.05 0.42 Wollastonite	Ca	K	2 72	0 02220	1 00	0.05	0.42	Wallactonita
		series	3.73	0.03320	1.23	0.05	0.42	vvoliastoriite
Zn K 102 0.01023 0.0 0.11 0.17 7	Zn	K	1 00	0.01022	0.0	0.11	0.17	7n
series 1.92 0.01923 0.0 0.11 0.17 21		series	1.92	0.01923	0.0	0.11	0.17	
Total: 100.00 100.00	Total:				100.00		100.00	

Dari hasil EDX menunjukkan terdapat atom unsur lain yang terkandung yaitu Ca dan Si.

3.4. Hasil Pengukuran Spektroskopi UV-Vis

Hasil Pengukuran UV-Visible dari lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO ditunjukkan pada Gambar 4. Dimana puncak absrobansi dari 3 sampel tidak terdapat pergeseran yaitu pada panjang gelombang 374 nm. Untuk mendapati nilai band gap dilakukannya analisis menggunakan metode tauc plot yang ditunjukkan pada Gambar 5 dan nilai enegi gap yang bersesuaian dengan panjang gelombang cutt-off terdapat pada Tabel 3.



Gambar 4. Hasil Pengukuran Spektroskopi UV-Vis



Gambar 5. Grafik Band Gap Analisis Metode Tauc Plot (a) Sampel FT 1, (b) Sampel FT 2, (c) Sampel FT 3

Recobaran						
Sampel	Ketebalan (nm) Absorbar		λcut-off	??		
		(a.u)	(nm)	(eV)		
FT 1	2078	0.091	374	3,87		
FT 2	2771	0.231	374	3,92		
FT 3	2216	0.076	374	3.74		

Tabel 3. Energi Gap dan nilai absorbansi Sampel Lapisan Tipis PVA/ZnO nanokomposit yang Disesuaikan dengan Panjang Gelombang Cut-Off dan ketebalan

Hasil dari analisa metode tauc plot menunjukkan nilai band gap maksimal pada sampel FT 2 dengan nilai 3,92 eV dan nilai band gap minimal pada FT 3 dengan nilai 3,72 eV.

3.5. Hasil Pengukuran Sifat Listrik IV Keithley

Hasil Pengukuran Sifat Listrik kurva I-V dituangkan pada Gambar 3.7.



Gambar 6. Kurva I-V sampel lapisan tipis PVA/ZnO nanokomposit (a) Sampel FT 1;(b) Sampel FT 2; (c) Sampel FT 3

Dari Gambar 6 terlihat jika resultan dari kurva menunjukkan linear atau kurva ohmic yang mana arus terbaca berskala nano dan memiliki nilai dibawah 0. berkesimpulan bahwa sampel bersifat isolator. Hasil ini dapat terjadi dikarenakan substrat yang digunakan adalah substrat kaca yang bersifat isolator.

Kurva arus dan tegangan pada Gambar 6 dapat dianalisis untuk mendapati nilai resistansi dimana nilai resistansi pada sampel FT 1 sebesar 1,80X109, FT 2 1,94X109, dan FT 3 sebesar sebesar 2,16X109. Dari nilai resistansi dapat menghitung nilai resistivitas dan konduktivitas yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Jarak Silver Paste (mm)	Ketebalan (nm)	A (m ²)	L(mm)	$\rho(\Omega)$	Konduktivitas (Ω^{-1})
2,06	2078	4,28068x1 0 ⁻⁹	4,033	1,91X1 0 ³	5,23X1 0 ⁻⁴
1,527	2771	4,23132X 10 ⁻⁹	2,798	2,94X1 0 ³	3,41X1 0 ⁻⁴
1,855	2216	4,11068X 10 ⁻⁹	3,302	2,68X1 0 ³	3,72X10 ⁻ 4

Tabel 4. Nilai Resistivitas dan Konduktivitas Lapisan Tipis Nanokomposit PVA/ZnO



Hasil XRD sampel FT 2 ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Hasil Substract Data XRD Sampel FT 2

Dilihat dari Gambar 7 bahwa sampel FT 2 terdapat 7 peak. Besar kristal yang

bersesuaian dengan nilai peak dan bidang hkl ditunjukkan pada Tabel 5.

	Tabel 5	5 Ukuran Kr	istal Sampel FT	2		
JCPDS	5 No. 36-1451	PVA/ZnO Nanokomposit		FWHM	D (nm)	
hkl	θ	hkl	θ			
(100)	31,77∘	(100)	31,8563°	0,19768	40,187	
(002)	34,422°	(002)	34,5077°	0,17771	44,703	
(101)	36,253°	(101)	36,323°	0,20296	39,142	
(102)	47,539°	(102)	47,5985°	0,22572	35,195	
(110)	56,603°	(110)	56,6956°	0,22892	34,703	
(103)	62,864°	(103)	62,9284°	0,27588	28,796	
(112)	67,963°	(112)	68,0114 ∘	0,19479	40,783	
				Rata-	42,5	
				Rata	15	
Hasil penguku	iran XRD pad	la sampel	meningkatnya	ketebalan	lapisan tipis	

Hasil pengukuran XRD pada sampel lapisan tipis PVA/ZnO nanokomposit FT 2 menunjukkan bahwa sampel lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO bersifat semi kristalin dikarenakan puncak-puncak difraksi yang kecil dengan stuktur heksagonal pada ZnO.

PENUTUP

Lapisan tipis nanokomposit PVA/ZnO telah disiapkan pada substrat metode kaca dengan spin coating berdasarkan variasi waktu berupa 30 detik, 60 detik, dan 90 detik hingga diperoleh hasil ketebalan sebesar 2076 nm, 2771 nm, dan 2216 nm untuk masing-masing variasi waktu. Analisis struktural menunjukkan aglomerasi disebabkan teriadinva yang tambahan nanopartikel ZnO pada matrikPVA. Sementara ukuran rata-rata partikel ZnO pada lapisan tipis PVA/ZnO sekitar 42.515 nm berdasarkan analisis XRD. Konduktivitas listrik menurun seiring dengan bertambahnya ketebalan lapisan tipis PVA/ZnO. Dan nilai celah pita menunjukkan peningkatan dengan

PVA/ZnO.

UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

Terima kasih yang sangat besar kami kepada Pa Muhammad Nasir dan asisten Loka Penelitian Teknologi Bersih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah memberikan masukkan dan saran pada penelitian ini, serta Pa Abrar untuk diskusi, dan Program Studi Teknik Fisika Telkom Bandung yang telah meminjamkan fasilitas untuk pengerjaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhoshan, M., S. Alsalhi, M., Aldwayyan, A., & Ansari, A. (2010). Prospects of Nanotechnology in Clinical Immunodiagnostics. Sensor, 10, 6538.
- Aslam, M., Kalyar, M., & Raza, Z. (2018). Polvvinvl Alcohol: Review Α of Status Research and Use of Polyvinyl Alcohol Based Nanocomposites. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 11.

- Aziz, S., Abdullah, O. G., & Rasheed, M. (2017). A novel polymer composite with a small optical band gap: New approaches for photonics and optoelectronics. *Journal of Applied Polymer Science, 134*, 3.
- Chamankar, N., Khajavi, R., Yousefi, A., & Rashidi, A. (2020). A flexible piezoelectric pressure sensor based on PVDF nanocomposite fibers doped with PZT particles for energy harvesting applications. *Ceramics International*(46).
- Fitriani, & Handani, S. (2017). Pengaruh Temperatur dan Waktu Putar Terhadap Sifat Optik Lapisan Tipis ZnO yang Dibuat dengan Metode Sol-Gel Spin Coating. *Jurnal Fisika Unand, 6*(2), 158.
- Jilani, A., Abdel-wahab, M., & Hammad, A. (2017). Advance Deposition Techniques for Thin Film and Coating. In *Modern Technologies for Creating the Thin-film Systems and Coatings* (p. 144). IntechOpen.
- Kandulna, R., & Choundhary, R. (2017). Concentration-dependent behaviors of ZnO-reinforced PVA–ZnO nanocomposites as electron transport materials for OLED application. *Polym. Bull.*, 3.

- Kumar, A., Nagaraja, K., & Nagaraja, H. (2015). Polymer assisted preparation and characterization of ZnO and Sn doped ZnO nanostructures. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 73*, 1.
- Lee, J., Bhattacharyya, D., Easteal, A., & Metson, J. (2008). Properties of nano-ZnO/poly(vinyl alcohol)/poly(ethylene oxide) composite thin films. *Current Applied Physics, 8*, 43.
- Porel, S., Venkatram, N., Rao, D., & Radhakrishnan, T. (2007). In Situ Synthesis of Metal Nanoparticles in Polymer Matrix and Their Optical Limiting Applications. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, *7*(6), 1887.
- Sreeja, S., Sreedhanya, S., Smijesh, N., Philip, R., & Muneera, C. (2013). Organic dye impregnated poly(vinyl nanocomposite alcohol) as an efficient optical limiter: structure. morphology and photophysical properties. Journal of Materials Chemistry C, 2.
- Viswanath, V. (2016). ZnO-PVA nanocomposite films for low threshold optical limiting applications. *American Institute of Physics, 1620*, 604-610.